

开关复位型前放芯片 CPRE_SW2 的噪声及抗辐射性能 测试

本文介绍了一种匹配冷却型半导体探测器的开关复位型前放芯片 CPRE_SW2，探索其三种不同的复位工作模式，实现对探测器信号的预处理，具有高能量分辨率低噪声的优点。文中给出了芯片的电子学测试过程及与实际探测器联调结果，并针对单粒子锁定效应对芯片进行了辐照试验。

Summary

对芯片进行完整的噪声测试与抗辐照测试后我们发现芯片具有较低的噪声和较高的抗单粒子锁定 (SEL) 性能。

Primary authors: Mr WANG, Ke (Institute of high energy physics, CAS); Ms LI XIAN, Xian (高能所); Mr CAO, Xuelei (Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Science); Ms BAO, Ziyu (Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Science)